◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-293729

@Int.Cl.⁴	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和63年(198	88)11月30日
G 11 B 7/24 G 02 F 1/05		A - 8421 - 5D A - 8106 - 2H				
G 11 C 11/22 // C 08 F 214/22	MKM	8522-5B 7602-4J	春査請求	未請求	発明の数 1	(全4頁)

匈発明の名称 強誘電性高分子光メモリー

②特 願 昭62-127953

❷出 願 昭62(1987)5月27日

②発	明	者	山口	則	男	東京都大田区中馬込1丁目3番6号	株式会社リコー内
⑫発	明	者	氏 家	孝 :	=	東京都大田区中馬込1丁目3番6号	株式会社リコー内
②発	明	者	井 上	俊	各	東京都大田区中馬込1丁目3番6号	株式会社リコー内
⑫発	明	者	- 首 藤	美美	P	東京都大田区中馬込1丁目3番6号	株式会社リコー内
砂出	頣	人	株式会社	± リコ・	_	東京都大田区中馬込1丁目3番6号	
创代	理	人	弁理士 小	松秀	五	外2名	

明細書

1. 発明の名称

強誘電性高分子光メモリー

2. 特許請求の範囲

電極に接してふっ化ビニリデン系重合体膜を記録層として含む強誘電性高分子光メモリーにおいて、該電極と該ふっ化ビニリデン系重合体膜との間に下引き層を形成したことを特徴とする強誘電性高分子光メモリー。

3. 発明の詳細な説明

[技術分野]

本発明はふっ化ビニリデン系重合体を用いた 強誘電性高分子光可逆メモリーに関するもので ある。

[従来技術]

ふっ化ビニリデン系重合体を記録層に用いた 強誘電性高分子光メモリーはすでに知られてい る。

これは該重合体の強誘電性を利用した画期的 な光メモリーで、その原理は特開昭59-215096 号公報、同59-215097号公報に開示されているように、強誘電体メモリー材料が電界によって分極する性質を利用して書き込みを可能にし、更に光または熱による焦電効果を利用して読み出すことができると記述されている。

この様な強誘電性高分子をメモリーとして使用する場合、応答である焦電電流を正確に読み取り更に確実な書き込みを行うためにはふっても、 にサンドイッチ構造を形成している全体を含むなっな系の分子は総じて化学的にあるため、 いか系系剤等に侵され難い傾向にあるため、 の金属素剤やであった。 を通べのふったというであった。 を通べのなった。

そのため光メモリーとしての信頼性に問題が あった。

[目的]

本発明は上記したふっ化ビニリデン系重合体

膜と電極間の密着性を改善した強誘電性高分子 光メモリーを提供することを目的とするもので ある。

[構成]

本発明者は、従来より上記課題の解決のため 研究を重ねてきたが、電極面とふっ化ビニリデン系重合体膜との間に下引き層を設けることに より、解決を図ることができることを見出し、 本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明は電極に接してふっ化ビニリデン系共重合体膜を記録層として含む強誘電性高分子光メモリーにおいて、該電極と該ふっ化ビニリデン系重合体膜との間に下引き層を形成したことを特徴とする強誘電性高分子光メモリーである。

以下本発明を図面に基づいて説明する。第1 図は本発明の強誘電性高分子メモリーのモデル 図である。この図中の 1がふっ化ピニリデン系 重合体から成る記録層部分であり、 2が電極基 板、 3が下引き層である。該下引き層 3は必ず

ング等の溶液塗布法や蒸着法、昇華法を利用することができる。この中でも蒸着法、ローラコーティング法が生産性の点からも好ましい。

本発明の高分子光メモリーの記録層として用いるふっ化ビニリデン系重合体は、ふリデンのホモ重合体及びふっ化ビニリデン体を50 重量の放け重合体としてはなっ化ビニリデンはある。該共重合体としてはなっ化ビニリデンとこったとの共重合体を対してはないではないがある。 にはエチレン等との共重合体を挙げることができるが、本発明においてチレンと言ふった とこりデンと言ふった とこりデンと言ふった とこう。

記録層であるふっ化ビニリデン系重合体膜を 関膜する方法としては浸漬コーティング、スプ レーコーティング、スピナーコーティング、カ レードコーティング等の溶液塗布法によって形 成することができる。この中でも浸漬コーティ ングやスピナーコーティングによるものが該記 しも電極基板 2表面のみに形成するだけでなく、例えば第2図のように記録暦 1表面にこれを形成しても構わない。

上記物質を用いて該下引き層を形成する方法 として浸漬コーティング、スプレーコーティン グ、スピナーコーティング、プレードコーティ ング、ローラコーティング、カーテンコーティ

録層を均一な膜厚に形成し得る点からも好ましい。

本強誘電性高分子メモリーが光メモリーとし て機能するためには記録層1を挟む電極の少な くとも一方が照射光に対してできる限り透明で あることが望ましく、特に本発明では電極基板 2に透明電極又は半透明電極を採用することが 好ましい。勿論電極基板 2及び上部電極 4の両 方が透明であっても良く、又上部電極 4のみが 透明であっても構わない。本発明で採用される 透明電極とはスズをドープした酸化インジウム (ITO)や酸化スズ、アンドープの酸化イン ジウム等が挙げられ、半透明電極には金、白金、 銀、鉛、亜鉛、アルミニウム、ニッケル、タン タル、チタン、コバルト、ニオブ、パラジウム、 スズ等の各種金属の蒸着、CVD、スパッタリ ング膜等が挙げられるが特にこれらに限定され るものではない。

またこれらの電極の支持体材料としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、

ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリビニルアルコール、ポリアミド、ポリイミド、ポリイン、アクリル樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂等の各種プラスチックやガラス、石英板、セラミックなどが好適であるが、電極く、関係照射光に対して透明であることが望ましい。

第3図には上部電極 4上に保護圏 5を設けた 例を示したが、この保護圏は記録をキズ、ホコリ、汚れ等からの保護及び記録圏の保存安定性 の向上等を目的として、各種高分子材料やシランカップリング剤などから形成される。

以下実施例をもって本発明の説明を行うが、 本発明はこれら実施例にのみ限定されるもので はない。

実施例1

厚さ 1mmの硼珪酸板ガラス上にITOを蒸替して電極を形成した後に、ヘキサメチルジシラザン(HMDS)のイソプロピルアルコール溶

厚さ 1mmのソーダガラス上に酸化スズを蒸着した後にトリメチルクロルシラン(TMCS)のイソプロピルアルコール溶液をスプレーコートして、60℃で30分間乾燥して下引き層をよ形成した。その後、実施例1と同様の操作によりサンブルを作製・評価をしたところ、実施例1と同様な結果が得られた。

実施例3

市阪のNESAガラスを電極基板として採用して、その表面にHMDSを蒸着して下引き層を形成した。上記と同様な操作をしたところ実施例1と同様な結果が得られた。

実施例4

ポリエチレン樹脂表面にスパッタリング法によりニッケルの半透明電極を形成して、チタン系カップリング剤のアンカーコート剤を塗布して下引き層を形成した。上記と同様の方法で評価したところ、実施例1と同様の結果が得られた。

[効 果]

液を塗布し、60℃で30分間乾燥して下引き圏 を形成した。さらに該下引き層上にスピンコー ト法によりふっ化ビニリデンー三ふっ化エチレ ン系共重合体(65/35) 膜を厚さ 1 µ m で塗布し て記録暦を形成せしめた。乾燥後このサンブル に対してセロテープを貼り、剥離テストを行っ た。下引き層を設けていない従来のふっ化ビニ リデンー三ふっ化エチレン共重合体膜は容易に 電極基板から剥がれることが確認されたのに対 して、本サンブルでは剥離されなかった。また、 本サンプルの上部電板としてアルミニウムを蒸 **着した後にふっ化ピニリデン-三ふっ化エチレ** ン共重合体膜を 100Vの電圧をかけてポーリン グ処理を施した後に、半導体レーザーでレーザ 一光の強度を変えなから上部電極を加熱して電 極間に生じる焦電電流を計測したところ数ナノ アンペアの微小電流をも測定することが可能で あることが判明した。上記テストを1月後に再 試行してもその効果は全く変わらなかった。

実施例2

以上の説明から明らかなように、本発明の構成によれば、ふっ化ビニリデン系重合体膜と電極との密着性が改善され、該重合体膜を記録層とする強誘電性高分子メモリーの信頼性を向上することができる等顕著な効果を奏するものである。

4. 図面の簡単な説明

第1、2 および3 図は本発明の強誘電性高分子メモリーのモデル図、

1…ふっ化ビニリデン系重合体膜、

2…電極基板、 3…下引き層、 4…上部電極。

特許出願人 株式会社リコー 代理人 弁理士 小 松 秀 岳 代理人 弁理士 旭 宏 代理人 弁理士 加々美紀雄

